

Příloha č. 1: Technické podmínky

SPM mikroskop s možností měření v externím magnetickém poli musí splňovat následující kritéria:

Funkce	Hodnota (minimální požadavky)	Uchazečem nabízené zařízení (uchazeč uvede příslušnou hodnotu)
<u>měřicí módy SPM mikroskopu ve vzduchu</u>	Contact AFM, lateral force microscopy (LFM), Resonant Mode (semicontact, noncontact AFM), Phase Imaging, Magnetic Force Microscopy (MFM), Electric Force Microscopy (EFM), Scanning Kelvin probe microscopy, AFM Litography	
<u>In plane magnet</u> generované magnetické pole v rovině vzorku o velikosti	minimálně 0,1 T (pro velikost mezery 15 mm)	
<u>vyměnitelné pólové nádstavce (in-plane magnet)</u>	Ano	
<u>Out of plane magnet</u> generované magnetické pole ve směru kolmém ke vzorku	minimálně 0,01 T	
<u>Oba magnety schopny měřit vzorky</u>	o rozměrech 15x15 mm	
<u>Skener</u> Rozsah skenování:	alespoň 70x70x7 µm	
Nelinearita v osách xy:	nejvýše 0,2%	
Nelinearita v ose z:	nejvýše 2%	
<u>Základna systému SPM a přiblížení vzorku</u>		
<u>Automatické i manuální přiblížování vzorku</u>	Ano	
<u>videomikroskop s manuálním zoomem pro optické rozlišení</u>	minimálně 3 µm	
<u>konektory pro připojení skenerů (měřicích hlav)</u>	Ano	
<u>SPM kontrolér</u>		
<u>kontrola kapacitních senzorů</u>	Ano	
<u>počet obrazů zaznamenaných během jednoho skenu</u>	minimálně 4 obrazů	
<u>maximální délka kabelu mezi měřicí hlavou a kontrolerem</u>	minimálně 2 m	
<u>Antivibrační systém</u>		
<u>zatížitelnost</u>	minimálně 100 kg	
<u>rozsahy izolace</u>	dynamická 0,7 -1000 Hz pasivní nad 1000 Hz	

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku. Dodavatel dále doplní:

Výrobce:

Typové označení výrobků: